



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA



Zwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych półprzewodników za pomocą ultraczułych metod stało-napięciowych, przy wykorzystaniu wzorców metrologicznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych - ruchliwości i koncentracji nośników ładunku elektrycznego, dzięki czemu możliwa będzie precyzyjna identyfikacja kanałów przewodnictwa w półprzewodnikowych warstwach epitaksjalnych. Przedmiotem badań będą domieszkowane struktury półprzewodnikowe, których badania są uzasadnione potrzebami ośrodków badawczych, dysponujących technologią wzrostów epitaksjalnych, przemysłu półprzewodnikowego, medycznego, zbrojeniowego i wielu innych branż, w których stosuje się podzespoły optoelektroniczne. Kluczowe w realizacji celu projektu jest wykorzystanie wzorców metrologicznych.

Źródło finansowania:	Ministerstwo Edukacji i Nauki – program Polska Metrologia
Okres realizacji projektu:	30.06.2022–29.06.2024
Całkowity koszt realizacji projektu:	880 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu w WAT:	880 000,00 PLN